

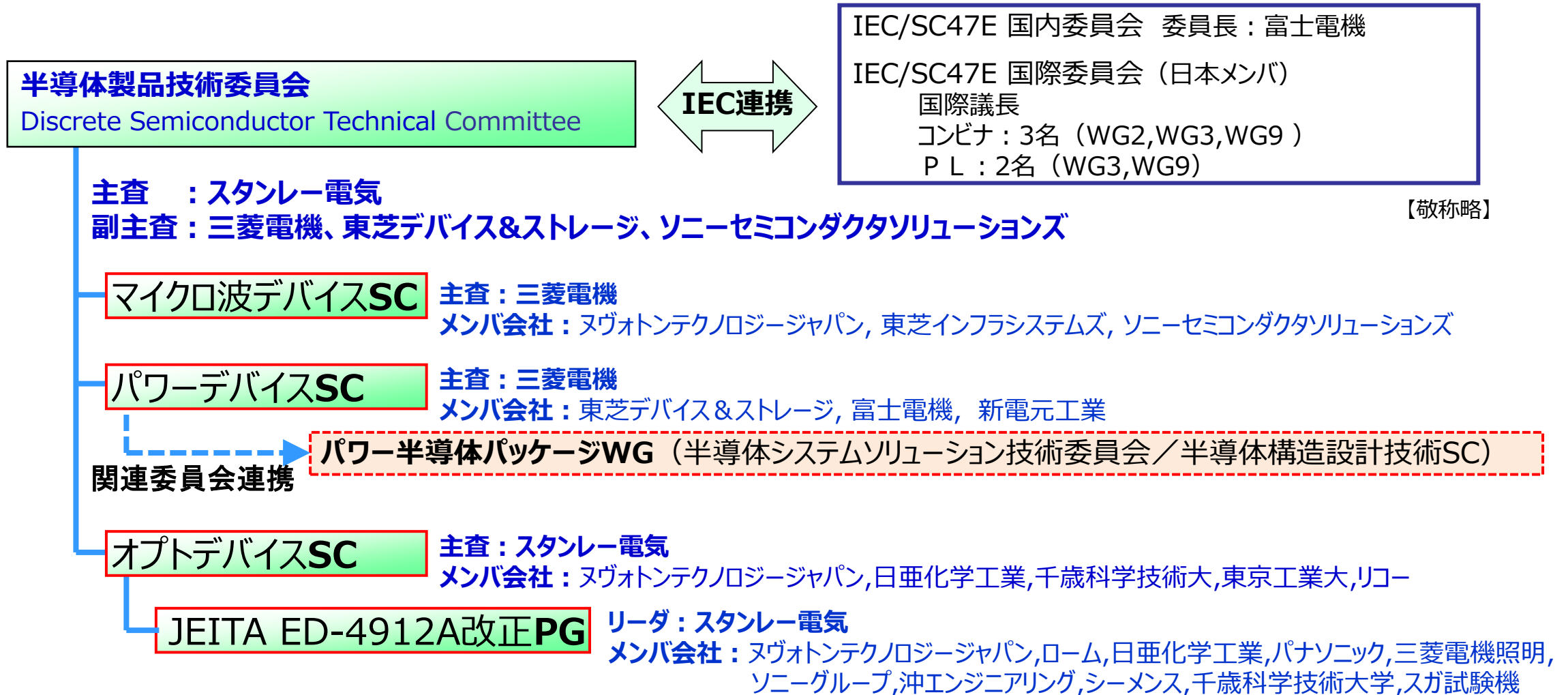
半導体製品技術委員会活動紹介

《目次》

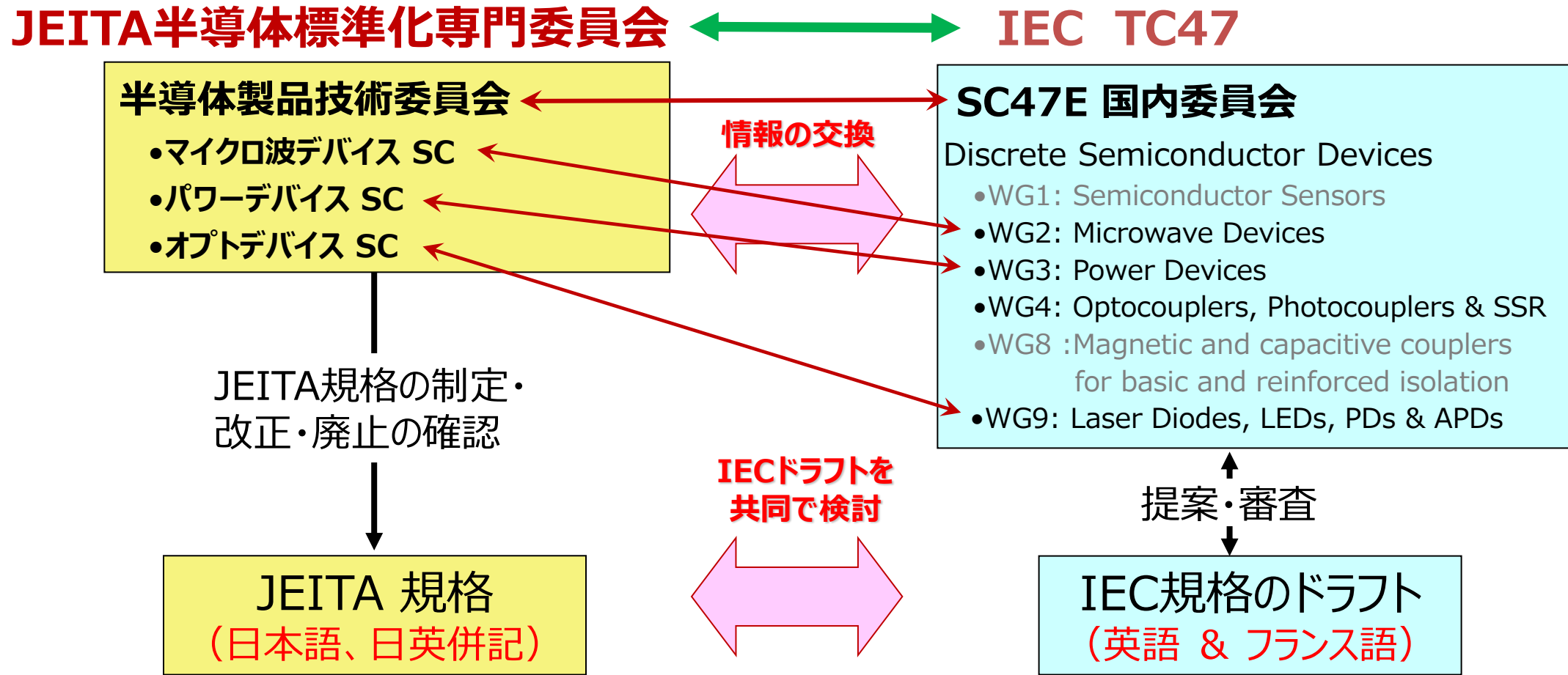
1. 2022年度活動実績
2. 2023年度活動計画

1. 2022年度半導体製品技術委員会活動実績

2022年度半導体製品技術委員会活動体制



JEITAとIECとの連携体制



1. 2022年度半導体製品技術委員会活動実績

半導体製品技術委員会活動成果サマリー

◆ **委員会 全体活動** : HP情報更新 **6月完了**、委員会規約改正 **9月 規約改正完了**

● マイクロ波デバイス S C

- **JEITA規格類の総合的な整備** : JEITA ED-4359の改正審議と規格発行 (2023年3月) **継続審議中**
- **IEC規格の審議** : IEC 60747-16-7 (Attenuators)、16-8 (Limiters)、16-9 (Phase Shifters)、16-11 (Detectors)
FDIS可決、IS発行 **FDIS可決、IS発行** **CC回付** **NP可決 RVN回付**

● パワーデバイス S C

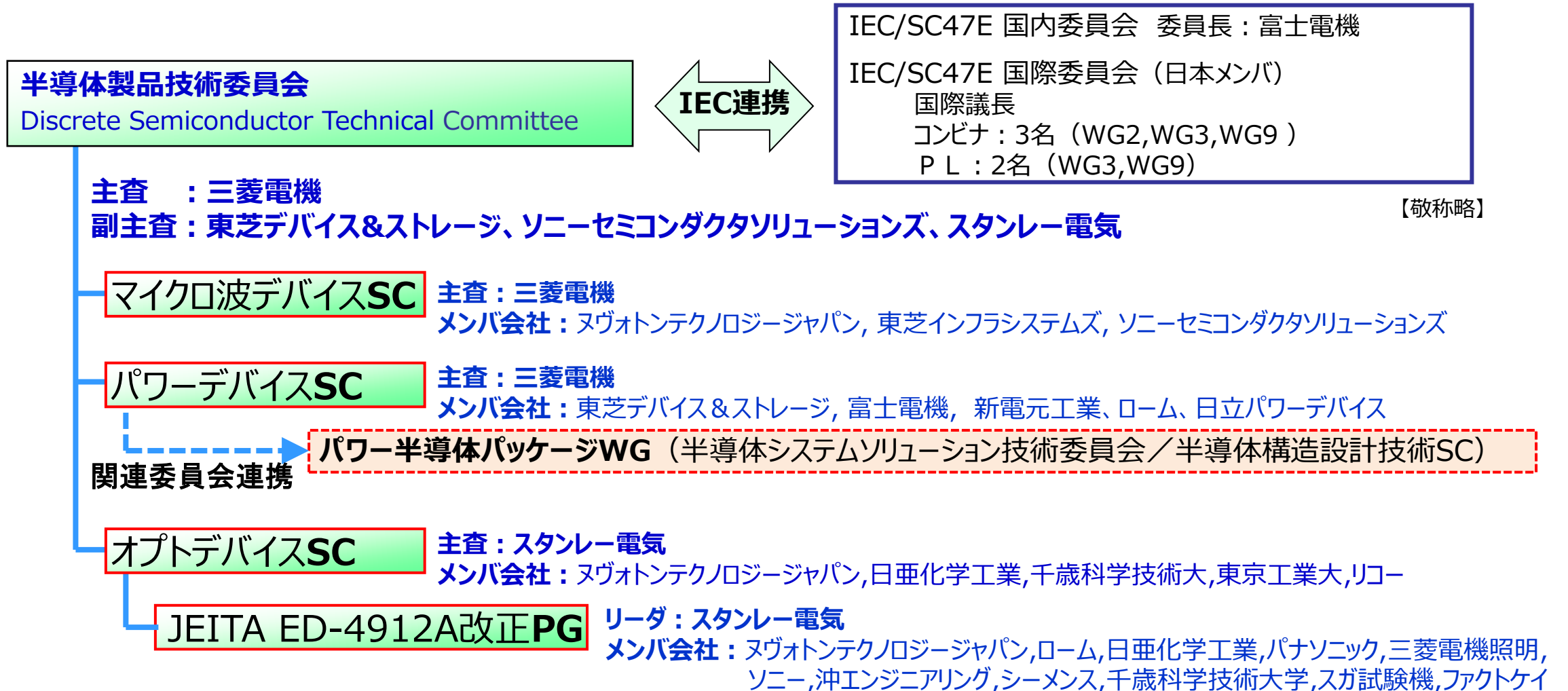
- **日本発IEC規格の提案～発行** : IEC 60747-15 Ed3 (Isolated power semiconductor devices) のCD回付 **CC回付**
- **標準化事業に係わる関連委員会との活動** **継続審議中**
 - ・ **パワー半導体パッケージWG** : 半導体システムソリューション技術委員会 / 半導体構造設計技術SCと共同開催
 - ・ **化合物パワー半導体信頼性技術WG** : 半導体信頼性技術委員会 / 個別半導体信頼性規格PGと連携 **継続審議中**

● オプトデバイス S C

- **JEITA規格類の総合的な整備**
 - ・ **JEITA ED-4912A(LED) 改正PG**にて、硫化腐食試験方法精査を含むED-4912A改正を審議 **継続審議中**
 - ・ 新たな半導体レーザ規格開発のフェージビリティスタディ (IEC提案も見据えたJEITA規格の開発検討) **継続審議中**
- **日本発IEC規格の提案～発行** : IEC 60747-5-4 Ed2 (半導体レーザ) のIS発行 **完** → **Ed2,Amd1のRR及びCD回付準備中**

2. 2023年度半導体製品技術委員会活動計画

2023年度半導体製品技術委員会活動体制



2023年度半導体製品技術委員会会議日程

1. 半導体製品技術委員会 (全4回、3か月ごとの第1金曜日)

- 6月 2日(金)、SC47E国内委員会併催
- 9月 1日(金)、 "
- 12月 1日(金)、 "
- 3月 1日(金)、 "

2. 各サブコミッティー および プロジェクトグループ

- マイクロ波デバイスSC (全4回、SC47E/WG2と併催)
5月12日(金)、8月25日(金)、11月10日(金)、2月9日(金)
- パワーデバイスSC (全4回、SC47E/WG3と併催)
6月7日(水)、9月6日(水)、12月6日(水)、3月6日(水)
- オプトデバイスSC (全3回、SC47E/WG9と併催)
6月15日(木)、10月5日(木)、2月15日(木)
- JEITA ED-4912A(LED) 改正PG (全4回)
6月1日(木)、8月31日(木)、11月30日(木)、2月29日(木)

2023年度半導体製品技術委員会主要活動アイテム

● マイクロ波デバイス S C

- SC47E/WG2との合同会議（4回/年）開催
- JEITA規格類の総合的な整備：JEITA ED-4359の発行(2024年4月)
- IEC規格の審議：IEC 60747-16-9 (Phase Shifters)、IEC 60747-16-11 (Detectors)

● パワーデバイス S C

- SC47E/WG3との合同会議（4回/年）開催
- 日本発IEC規格の提案～発行：IEC 60747-15 Ed3 (Isolated power semiconductor devices)のCDV回付
- IEC規格の審議：IEC 60747-2 Ed4 (Rectifier diodes)、IEC 60747-6 Ed4 (Thyristors)
- 標準化事業に係わる関連委員会との活動
 - ・ パワー半導体パッケージWG(熱設計、外形)：半導体システムソリューション技術委員会／半導体構造設計技術SCと共同開催
 - ・ 化合物パワー半導体信頼性技術WG：半導体信頼性技術委員会／個別半導体信頼性規格PGと連携

● オプトデバイス S C

- SC47E/WG9との合同会議（3回/年）開催
- 日本発IEC規格の提案～発行：IEC 60747-5-4 Ed2 Amd1(半導体レーザ)のCDV回付
- JEITA規格類の総合的な整備
 - ・ JEITA ED-4912A(LED) 改正PGにて、硫化腐食試験方法精査を含むED-4912Aの改正審議と規格発行
 - ・ 新たな半導体レーザ規格開発のフィージビリティスタディ(IEC提案も見据えたJEITA規格の開発検討)